质子辅助生长超平整石墨烯薄膜

袁国文 高力波

(南京大学物理学院 固体微结构物理国家重点实验室 南京 210093)

2020-02-27 收到 † email: lbgao@nju.edu.cn DOI: 10.7693/wl20200308

石墨烯(graphene),碳原子组成的二维蜂窝 状结构, 是构成其他碳材料的基本单元, 可以 蜷曲成零维的富勒烯,弯曲成一维的碳纳米 管,以及堆垛成三维的石墨[1]。石墨烯有着独特 的晶体结构和能带结构,有着区别于块体的多 种特异物性,包括了力、热、光、电学等性 能,有望在多种领域取得颠覆性的应用。正因 为如此,石墨烯一经发现,便迅速成为物理、 化学、材料、电子等多个学科中一颗冉冉升起 的新星、并开启了包括石墨烯在内的多种二维 材料及其异质结构的研究热潮四。据不完全统 计,目前相继有多达500多种的二维材料开始 深入表征与研究。

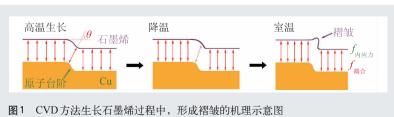
一般来说,新材料的未来应用前景,不仅取 决于材料自身的性质, 更取决于如何可控地制备 这种新材料,即"制备决定未来"。因此,对于 包括石墨烯在内的多种二维材料,发展出若干种 可控制备宏量、高质量样品的制备方法, 是实现 其未来"颠覆性"应用,推动科技发展的前提和 保障。石墨烯,经历了2004年首次发现后的16 年快速发展期,目前已经开发出了多种制备方 法,包括有胶带剥离法、化学剥离法、碳化硅外 延法和化学气相沉积(chemical vapor deposition, CVD)法等[2]。其中, CVD方法日趋成为制备大面 积、高质量石墨烯单晶晶粒或者薄膜的最主要方 法。CVD方法的基本原理,是利用过渡金属等多 种生长基体, 在高温环境下对气态碳源进行催化

裂解,进而在基体表面生长出单层或者少层的石 墨烯[3-5]。然而, 生长在金属基体上的石墨烯, 由 于金属基体的掺杂,会丧失其特殊的物性,因 此,为了进行深入的表征和物性研究,通常需要 将生长完成的样品转移到绝缘衬底上。石墨烯的 可控生长和相应的转移技术,共同组成了CVD方 法制备石墨烯的完整链条。目前,通过CVD方法 制备的石墨烯,已经可以初步满足一些产业应用 的需求。

值得注意的是, CVD 方法获得的石墨烯, 其较高的晶体质量是相对于化学剥离法和碳化 硅外延法而言的,而相较干胶带剥离法获得的 石墨烯片层,仍然有所欠缺。这是因为当前 CVD 方法在制备石墨烯的过程, 仍然会引入晶 体缺陷。缺陷的来源主要有两种,一种是在 CVD生长过程带来的点缺陷(point defect)、晶界 (grain boundary)^[6]和褶皱(wrinkle)^[7];另一种是转 移过程引起的破损(crack)、折叠(fold)和撕裂 (tear)等。CVD方法制备石墨烯,经过了逾十年 的发展,现在已经发展出了包括局部通入气态 碳源等方法在内的多种途径,成功地生长出厘 米级的石墨烯六角形单晶晶粒[8],以及开发多种 转移方式来消除转移缺陷。然而,这些无点缺 陷、无晶界、无转移缺陷的石墨烯晶粒或者薄 膜, 其多种物理特性, 尤其是大尺寸下电学输 运特性,依然逊色于本征石墨烯。究其原因, CVD 方法下石墨烯的褶皱,或许是影响其物性

提升的更为重要的因素。

褶皱, 是由石墨烯与生长基体 之间的热涨率差异所导致的。传统 的CVD生长过程中, 石墨烯和生长 基体具有比较强的耦合作用。因 此,在生长结束后的降温过程中(通



常生长温度大于800℃),石墨烯的 低热涨率会为其引入比较大的压应 力,而褶皱作为释放压应力的一种 途径,会频繁地在沿着和垂直于生 长基体原子台阶位置出现(图1)。褶 皱诵常被认为是一种典型的线缺 陷,类似于晶界,会在一定程度上 影响石墨烯的均匀物性。例如,褶 皱位置,通常容易引发点缺陷,会 影响石墨烯的防氧化性以及电学输 运特性門。尽管已经有众多的研究组 尝试解决这一问题, 例如采用热涨 率比较小的金属基体铂,或者热涨 率更小的非金属基体如碳化硅、二 氧化硅/硅等,或者利用更低的生长 温度,或者采用与石墨烯结合能力 更强的金属镍作为基体, 然而, 生 长出来的石墨烯中,褶皱仍旧存 在。因此,如何有效根除褶皱,既 是 CVD 制备石墨烯领域的重点,又是难点。

我们尝试过多种方法调控用来消除褶皱,效果依然有限。在总结大量实验结果的基础上,我们发现,极低碳氢比(CH4:H2)的生长参数,会在一定程度上弱化石墨烯与生长基体之间的耦合作用,进而降低石墨烯的平均褶皱高度。因此,我们认为,减弱石墨烯与生长基体之间的耦合作用,或许是消除褶皱的唯一途径。为此,我们通过理论模拟发现,处于石墨烯与生长基体之间的氢,在高浓度和高温条件下,可以增大两者之间的层间距,并起到减弱耦合的作用。考虑到在热氢气的组分中,只有质子^[10]和电子能够自由穿梭于石墨烯的蜂窝状晶格,我们再次推测质子在穿透石墨烯后,会有一定概率再次与电子结合成氢,

有鉴于此,我们在生长过程中引入了等离子体辅助技术,促使气体能够有效分解,同时采用氢气(H₂)、氘气(D₂)、氦气(He)等离子体,进行了辐照处理效果的对比,结果进一步验证了我们所设想的脱耦过程。唯有增加质子密度,并使其重

进而起到减弱石墨烯与生长基体的耦合作用。

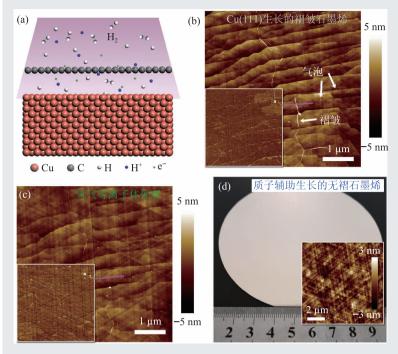


图 2 (a) 质子渗透和氢辅助脱耦合模型; (b) 普通 CVD 方法生长的有褶皱石墨烯; (c) 氢气等离子体处理后的同位置褶皱变化; (d) 质子辅助生长的超平整石墨烯藻膜

新结合成足够浓度的氢,这是减弱二者耦合作用的关键途径。因此,我们采用了氢气等离子体处理褶皱化的石墨烯薄膜,并辅以高温,发现可以逐步减弱并彻底消除已经存在的石墨烯褶皱。如果在生长石墨烯的同时,引入氢气等离子体辅助,则生长出来的为超平整、无褶皱的石墨烯薄膜(图2)。

为了全方位地表征石墨烯是否真正无褶皱,除了常规的原子力显微镜(AFM)表征形貌,我们同时也采用了多种结构表征工具,包括扫描隧道显微镜(STM)表征莫尔条纹变化、扫描隧道谱(STS)对比能隙、角分辨光电子能谱(ARPES)观测大尺寸下石墨烯与生长基体的耦合作用变化、变温拉曼光谱对比内应力变化等,结果都表明了这种超平整的石墨烯薄膜,处于与生长基体脱耦合、自身无掺杂的形态。

由于石墨烯薄膜的超平整特性,因此在清除 其表面的其他污染物,尤其是石墨烯转移过程中 的转移介质(通常为PMMA)残留时,表现出极易 清洁的优点。为了突显这种超平整石墨烯薄膜的

・ 179 ・

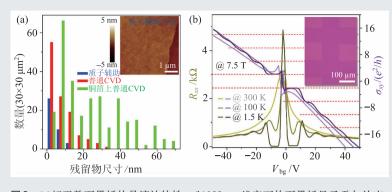


图3 (a)超平整石墨烯的易清洁特性,(b)100 μ m 线宽下的石墨烯量子霍尔效应,出现的阈值与本征石墨烯相当

特点,即大尺寸均匀和高品质,我们进行了不同沟道线宽下的量子霍尔效应测量,线宽分别为2 μm、20 μm、100 μm、500 μm。此前,有碍于大尺寸石墨烯样品的均匀性,石墨烯量子霍尔效应能够出现的最大线宽为50 μm。而这种方法生长出来的超平整石墨烯薄膜,量子霍尔效应出现的阈值

条件,和1 µm线宽时测量的本征石墨烯(胶带法获得)几乎相当。更为重要的是,对于不同沟道线宽,量子霍尔效应的阈值几乎不变(图3)。本研究结果也最终证明,只有消除褶皱,才能在最大程度上实现了高品质石墨烯在大尺寸下的均质化。

本项研究成果近期已于Nature 上刊登发表[iii]。这种质子辅助方法 制备的超平整石墨烯薄膜,根除了 CVD 石墨烯中的褶皱,保证了石

墨烯薄膜的超高质量,对未来实现石墨烯在高端产业化应用,或许会起到较大的推动作用。不仅如此,提出和有效验证的质子渗透模型,可以很容易拓展到其他材料,为调控其掺杂和内应力等,或可打开新的研究思路。

参考文献

- [1] Geim AK, Novoselov KS. Nat. Mater., 2007, 6:183
- [2] Novoselov K S et al. Nature, 2012, 490: 192
- [3] Reina A et al. Nano Lett., 2009, 9:30
- [4] Kim K S et al. Nature, 2009, 457:706
- [5] Li X S et al. Science, 2009, 324: 1312
- [6] Huang PY et al. Nature, 2011, 469:389

- [7] Gao L B et al. Nat. Commun., 2012, 3:699
- [8] Wu T R et al. Nat. Mater., 2016, 15:43
- [9] Zhu W et al. Nano Lett., 2012, 12:3431
- [10] Hu S et al. Nature, 2014, 516:227
- [11] Yuan G W et al. Nature, 2020, 577:204

读者和编者

新书推荐

